# 一次元疎水性ナノ空間における水クラスター構造 (千葉大院理<sup>1</sup>、産総研<sup>2</sup>、信州大<sup>3</sup>) ○ 平成一<sup>1</sup>, 畠賢治<sup>2</sup>, 金子克美<sup>3</sup>, 加納博文<sup>1</sup>, 大場友則<sup>1</sup>

### 【緒言】

生体内では水が疎水性ナノ空間の生体膜を通過しており、疎水性ナノ空間中での水の構造を 知ることは、生体内の水分子の機能を知る上で非常に有用である。従って、ナノ空間に束縛さ れた水について今まで数多くの研究がなされてきた。二次元の疎水性ナノ空間をもつ活性炭内 に束縛された水は、構造の秩序化や特異的な相転移挙動など、バルクにはない特異的な挙動を 示すことが明らかになってきている<sup>1)</sup>。また、疎水性ナノ空間中に水が吸着するメカニズムと して、水がクラスターを形成しながら吸着し、そのクラスター形成によって水分子が疎水性ナ ノ空間中で安定化されていることが報告された<sup>2)</sup>。単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は一 次元の疎水性ナノ空間を有しており、二次元ナノ空間と比べてより生体内の水チャネルに即し た構造であると考えられる。低温において SWCNT 中の水は、アイスナノチューブとよばれる 氷構造を形成していることが提唱されている<sup>3)</sup>。しかしながら、SWCNT 中の水分子の氷形成過 程や挙動など詳細な構造は未だ解明されていない。そこで本研究では、SWCNT に水蒸気を吸 着させ、充填率による水分子の構造変化から、一次元疎水性ナノ空間における水分子の構造を より詳細に検討した。

#### 【実験】

産業技術総合研究所の畠博士から提供された Super Growth SWCNT<sup>4)</sup>を、酸素気流下において 723 K, 1 h 酸化処理 し、SWCNT の開孔処理を行った。この開孔処理により SWCNT の内部空 間に水が吸着される試料を調製した。真空加熱処理 (383 K, < 0.1 Pa, 2 h)後、容量法で 303 K に おける水蒸気吸着等温線測定を行った。X 線回折測定のため、SWCNT に真空処理(< 0.1Pa, 2 h) を行った後、303 K で水の充填率=20, 50, 80, 100%に対応する水蒸気を SWCNT に吸着させた。 (平衡時間 > 3 h)。シンクロトロン放射線施設 SPring-8 にて、X 線回折測定 ( $\lambda$ =0.1000 nm、積 算時間 30 min) を行った。得られた X 線回折から電子動径分布関数を求め、一次元疎水性ナノ 空間中の水の構造を調べた。

## 【結果・考察】

SWCNT のキャラクタリゼーションを行うため、真空加熱処理(423 K, < 0.1 Pa, 2 h)後、容量 法で 77 K における N<sub>2</sub> 吸着等温線測定を行った。N<sub>2</sub> 吸着等温線解析から、平均細孔径 2.5 nm, 細 孔容量 0.45 ml g<sup>-1</sup>,比表面積 1600 m<sup>2</sup> g<sup>-1</sup> である。Fig.1 にバルクの水、氷(I<sub>h</sub>)、SWCNT に吸着した 水(充填率=20%, 50%, 80%, 100%)の X 線回折パターンを示す。ここで吸着した水分子の X 線回 折パターンは、水が吸着した SWCNT の X 線回折パターンから、SWCNT の X 線回 折パターンは、水が吸着した SWCNT の X 線回折パターンから、SWCNT の X 線回 折パターンは、水が吸着した SWCNT の X 線回 折パターンたる を差し引いて得られたものである。バルクの水の X 線回 折パターンをみると、散乱パラメータ  $s = 20 \text{ nm}^{-1}$ の位置に第 1 ピークがみられ、距離に換算すると 0.30 nm である。これは水分子間 の酸素 – 酸素間の距離に相当する。これに対し、SWCNT 中の水の第 1 ピークはすべて低波数 側にシフトしており、水分子間の酸素 – 酸素間の距離が広がっていることがわかる (20%: 0.34 nm, 50%: 0.39 nm, 80%: 0.38 nm, 100%: 0.37 nm)。充填率について比較すると、充填率=20%で はバルクの水と似た X 線回折パターンを示しているのに対し、充填率=50%では酸素-酸素間 の距離が広がり、氷の回折位置により近くなっている。つまり、充填率=50%の SWCNT 中の 水分子は氷のような構造を形成していると考えられる。更に、充填率=50%~100%では充填率 の増加に伴い、酸素-酸素間の距離が徐々に短くなっていることから、充填率=50%において、 SWCNT 中の水は最も酸素 - 酸素間の距離が離れた構造を形成していると考えられる。

Fig.2 に電子動径分布関数を示す。バルクの水のプロファイルをみると、r=0.30,0.45,0.67 nm の位置にピークがみられ、それぞれバルクの水の第1、第2、第3最近接分子に相当する。これ に対し、SWCNT 中の水(充填率=100%)はバルクとは明らかに異なるプロファイルを示してお り、r=0.28,0.37-0.51,0.60 nm 以降の位置にピークがみられる。まず、r=0.28 nm のピークは SWCNT 中の水の第1 最近接分子に相当し、氷の第1 最近接分子の距離(0.275 nm)に近くなって いることから、水素結合が強まり氷のような構造を形成している可能性がある。また、0.37-0.51 nm は第2 最近接分子に相当し、ピークがいくつも存在していることから、クラスターのような 秩序構造を形成していると考えられる。更に、0.60 nm 以降は第3 最近接分子以降の秩序構造を 示しており、バルクの水にはみられない 0.86 nm の位置にピークがみられたことから長距離秩 序性があることが示唆される。充填率=20%まではバルクの水と似たプロファイルを示している が、充填率=50%以上ではクラスター構造のプロファイルを示していることから、SWCNT 中の水は構造 が秩序化したクラスター構造を形成し、充填率=50%からクラスター成長過程があることが示 唆された。



Fig.1 SWCNT 中の水の X 線回折パターン

Fig.2 SWCNT 中の水の動径分布関数

#### 【参考文献】

- 1) T. Iiyama, K. Nishikawa, T. Suzuki, K. Kaneko, Chem. Phys. Lett., 1997, 274, 152-158.
- 2) T.Ohba, H.Kanoh, K.Kaneko, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 1560.
- 3) Y. Maniwa, H. Kataura, M. Abe, S. Suzuki, Y. Achiba, H. Kira, K. Matsuda, J. Phys. Soc. Jpn., 2002, 71, 2863-2866.
- 4) K. Hata, Don N. Futaba, K. Mizuno, T. Namai, M. Yumura, S. Iijima, Science., 2004, 306, 1362.